Search Notes

Application/Control No.	App
	Ree

10/602,566 Examiner

Blake E. Betz

Applicant(s)/Patent under Reexamination

SEWELL, MARC T. BURTON

Art Unit

2672

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	_	<u>:</u>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		; ;	
		,	
		:	
		:	
		:	

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
		-			
		:			
		,			
_		- :			
		:			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
Visio 2000 user guide	12/2/2004	88
Microsoft Paint user guide	12/2/2004	ВВ
EZFlow user guide	12/2/2004	ВВ